

ドリフトチェンバーを用いた飛跡再構成のためのセレクションと基礎特性の研究

5406068 森 和香奈

2008年、高エネルギー加速器研究機構にある富士テストビームラインにおいて、16本のドリフトチェンバーと2枚のシンチレーションカウンタを用いた宇宙線観測用飛跡検出器への、3GeV電子ビームの照射テストを行った。今回はこのビーム照射テストの結果を用い、飛跡の再構成に向けてデータのセレクションを行った。また、セレクションの結果を用いて、最小二乗法から予測される飛跡の再構成を行い、その結果から、今後さらに詳細な飛跡の再構成を行うためのTDCカウント値（ドリフト時間）と粒子の入射位置の関係式を求めた。